(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/085318 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: C08G 63/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002003

(22) Internationales Anmeldedatum:

25. Februar 2005 (25.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 010 680.0 4. März 2004 (04.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ZIMMER AG [DE/DE]; Borsigallee 1, 60388 Frankfurt a. Main (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OTTO, Brigitta

[DE/DE]; Bergstrasse 6a, 14715 Milow (DE). **REITZ, Hans** [DE/DE]; Helgebomstrasse 42, 61191 Rosbach (DE). **BACHMANN, Holger** [DE/DE]; Sandstrasse 21b, 64331 Weiterstadt (DE). **KIRSTEN, Klaus** [DE/DE]; Gustavsburger Weg 22, 55130 Mainz (DE).

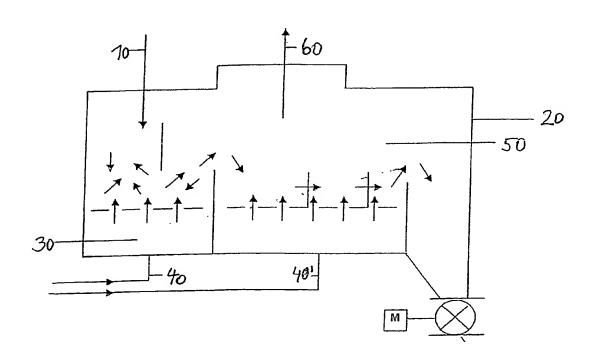
(74) Anwalt: HAMMER, Jens; Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, Maximilianstrasse 58, 80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING HIGHLY CONDENSED SOLID-PHASE POLYESTERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HOCHKONDENSIERTEN POLYESTERN IN DER FESTEN PHASE



(57) Abstract: The invention relates to a continuous or discontinuous method for producing highly condensed solid-phase polyesters involving a crystallization of a polyester material, this crystallization being effected in the presence of a gas having a dew point of less than or equal to approximately 10 °C. The invention also relates to a method for producing polyester shaped bodies while using the obtained polyester material to produce bottles, sheets, films and high-strength fibers.

WO 2005/085318 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. WO 2005/085318 PCT/EP2005/002003

Verfahren zur Herstellung von hochkondensierten Polyestern in der festen Phase.

Die Erfindung betrifft ein kontinuierliches oder diskontinuierliches Verfahren
zur Herstellung von hochkondensierten Polyestern in fester Phase,
umfassend eine Kristallisation eines Polyestermaterials, wobei die
Kristallisation in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt (Tp) von
(kleiner gleich) ≤ etwa − 10 °C durchgeführt wird. Des weiteren betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Herstellen von Polyesterformkörpern unter
Verwendung des erhaltenen Polyestermaterials zur Herstellung von
Flaschen, Folien, Filmen und hochfesten Fäden.

Die bekannten aromatischen Polyester oder Copolyester, insbesondere Polyetylenterephthalat und dessen Copolymere mit geringen Anteilen von beispielsweise Isophthalsäure oder Cyclohexandimethanol, Polybutylenterephthalat, Polytrimethylenterephthalat, Polyethylennaphthalat und deren Copolyestern, die als Ausgangsmaterial für Fasern, Filme, Folien und Verpackungen dienen, werden nach einer Schmelzepolykondensation zu Granulaten mittlerer Viskosität verarbeitet. Der mittlere Polykondensationsgrad, ausgedrückt in der Intrinsischen Viskosität (I.V.), bewegt sich bei Polyethylenterephthalat und seinen entsprechend niedrig modifizierten Copolyestern nach der Schmelzepolykondensation im Bereich zwischen 0,30 – 0,90 dl/g.

Da die Herstellung von Granulaten mit einer I.V. über 0.65 dl/g, insbesondere in konventionellen Autoklaven, kaum möglich ist und hohe Viskositäten > 0.80 dl/g eine wesentliche Kapazitätseinschränkung in der Schmelzepolykondensation nach sich ziehen und außerdem die Polyester für Lebensmittelverpackungen einen sehr niedrigen Acetaldehydwert erfordern, wird nach dem Stand der Technik der Schmelzpolykondensation eine Festphasenpolykondensation (SSP) angeschlossen, die zu einer Erhöhung der I.V. im allgemeinen um 0.05 — 0,4 dl/g und zu einer

20

25

30

sein.

ppm im PET (Polyethylenterephthalat) führt.

In dieser sich an die Schmelzepolykondensationsstufe anschließenden
Festphasenpolykondensation wird somit die mittlere Viskosität derart
angehoben, dass die für das entsprechende Verwendungsgebiet
notwendigen Festigkeiten erreicht werden, der Acetaldehydgehalt bei
Lebensmittelverpackungen entsprechend den Anforderungen abgesenkt und
der austretende Oligomerenanteil auf ein Mindestmaß reduziert wird. Dabei
ist es wichtig, dass außerdem der als Vinylester gebundene Acetaldehyd,
auch als Depot-Acetaldehyd bezeichnet, soweit abgebaut wird, dass bei der
Verarbeitung des Polyestergranulats zu Verpackungen, insbesondere zu
Polyesterflaschen nach dem Streckblas- und Spritzstreckblasverfahren im
Polyester nur ein minimaler Acetaldehyd nachgebildet wird. Speziell für die

Abfüllung von Mineralwasser in Polyesterflaschen sollten in der Flaschen-

wand aus Polyethylenterephthalat weniger als 2 ppm Acetaldehyd enthalten

Absenkung des Acetaldehydgehaltes von etwa 25 - 100 ppm auf Werte < 1

Neben der SSP sind Verfahren zur Entaldehydisierung von Polyethylenterephthalat durch Behandlung mit Stickstoff oder mit trockener Luft, wie im US-Patent 4,230,819 beschrieben, bekannt. Um den geforderten niedrigen Acetaldehydgehalt im Material zu erhalten, werden Temperaturen bis etwa 230 °C verwendet. Bei Verwendung von Luft ist bei derart hohen Temperaturen mit einem starken thermooxidativen Abbau des Polyesters zu rechnen. Beim Einsatz von Stickstoff erhöhen sich die Kosten für das Gas und die aufwendige Reinigung.

Im US-Patent 4,223,128 werden Temperaturen bei Einsatz von Luft als Trägergas oberhalb 220 °C ausgeschlossen. Die gewünschte Erhöhung der I.V. wird mit Hilfe großer Mengen trockener Luft mit einem Taupunkt von — 40 bis — 80 °C beschrieben. Bei der in den Beispielen dieses Patentes aufgeführten Behandlungstemperatur von 200 °C ist bei kontinuierlichen Verfahren, die ein mehr oder weniger breites Verweilzeitspektrum

aufweisen, die oxidative Schädigung einzelner Granulatkörner nicht auszuschließen.

In der SSP wird eine Kettenverlängerung der Polyester in fester Phase, um die in einer Schmelze stärker auftretenden Nebenreaktionen möglichst gering zu halten, und eine Entfernung der schädlichen Nebenprodukte erreicht. Mit dieser Kettenverlängerung, die sich in einer Erhöhung der I.V. ausdrückt, können Produkte, wie Flaschen oder Reifencord, die eine höhere Festigkeit erfordern, hergestellt werden. Da Polyester jedoch teilkristalline Thermoplaste sind, weisen sie je nach Art einen mehr oder weniger großen amorphen Anteil auf. Diese Tatsache bereitet bei der Durchführung der SSP Schwierigkeiten, da die amorphen Anteile bei den für die SSP notwendigen Temperaturen zu Verklebungen führen, die bis zum Stillstand der Produktionsanlage führen können.

15

::

20

25

30

10

Daher ist es außerdem bekannt, als Vorstufe zur SSP eine Kristallisation der teilkristallinen Chips aus der Schmelzepolykondensation zur Vermeidung der Klebeneigung unter Stickstoff- oder Luftatmosphäre, bei Temperaturen zwischen 160—210 °C durchzuführen, wie in den US-Patenten 4,064,112, 4,161,578 und 4,370,302 beschrieben.

In der WO 94/17122 wird eine 2-stufige Kristallisation mit Vorheizung und Zwischenkühlung vor der SSP zur Vermeidung von Verklebungen offenbart. Die beschriebene SSP- Temperatur liegt bei Temperaturen zwischen 205 und 230 °C.

Zur Verbesserung der Qualität der Chips kann, wie in JP 09249744 oder US 5,663,290 beschrieben, mit feuchtem Inertgas vor oder während der SSP gearbeitet werden oder, wie in dem US-Patent 5,573,820 offenbart, können die Chips vorher mit heißem Wasser oder direkt mit Wasserdampf intensiv bei Temperaturen bis zu 200 °C vor der Kristallisation behandelt werden. In diesem Fall ist aber bereits bei den üblichen Temperaturen von > 190 °C mit einem starken unerwünschten Abfall der I.V. durch Hydrolyse im PET zu

20

rechnen.

Ein weiteres Verfahren ist die Behandlung der zu kristallisierenden Chips mit gereinigtem ungetrockneten Stickstoff aus der SSP im Gegenstrom in einer 2. Kristallisationsstufe, wie in EP 222 714 dargelegt. Der dort beschriebene Effekt zur Reduzierung des Acetaldehydgehaltes wird eher als geringfügig bewertet.

Die bekannten Verfahren haben somit den Nachteil, dass der Einsatz von teurem, gegebenenfalls gereinigtem, Stickstoff erforderlich ist, ein großer apparativer Aufwand zur Verhütung von Verklebungen betrieben werden muß, hohe Temperaturen verwendet werden müssen, die einen entsprechenden energetischen Aufwand erfordern, oxidative Schädigungen auftreten und ein zu hoher Acetaldehydgehalt oder eine zu hohe Acetaldehydnachbildung auftritt. 15

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von hochkondensierten Polyestern in der festen Phase von aromatischen Polyestern und deren Copolymeren zur Verfügung zu stellen, das apparativ vereinfacht ist und gleichzeitig die besonders hohen Qualitätsansprüche an den Polyester für Verpackungen bezüglich Viskosität, Farbe, Acetaldehydgehalt, Acetaldehydreformation, Oligomerenanteil beibehalten oder sogar verbessert werden.

- Die Lösung der Aufgabe ist ein Verfahren zum Herstellen von Polyestern, 25 umfassend eine Kristallisation eines Polyestermaterials, wobei die Kristallisation in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt von (kleiner aleich) ≤ etwa – 10 °C durchgeführt wird.
- Das vorliegende Verfahren ist geeignet zur Herstellung von Granulaten 30 teilkristalliner aromatischer Polyester oder Copolyester, erhältlich aus einer oder mehreren Dicarbonsäuren bzw. deren Methylestern, wie

Terephthalsäure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und/oder 4,4-Bisphenyldicarbonsäure und einem oder mehrerer Diole, wie Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,4-Cyclohexandimethanol, Neopentylglykol, Bisphenol A, und/oder Diethylenglykol.

5

Diese Ausgangsverbindungen können in an sich bekannter Weise nach dem kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Verfahren der Ver- oder Umesterung unter Verwendung von bekannten Katalysatoren mit einer sich anschließenden Schmelzepolykondensation unter Vakuum zu Polyestermaterial, vorzugsweise zu Granulat verarbeitet werden.

10

Vorzugsweise werden Polyethylenterephthalat - Homopolymere und Copolymere mit einem Comonomerengehalt von kleiner 10 Ma-% verwendet.

15

Verfahren zum Herstellen von Polyestern umfassen allgemein eine Veroder Umesterung, eine Schmelzepolykondensationsstufe, eine Kristallisation und gegebenenfalls eine Festphasenpolykondensation. Dadurch wird ein Polyestermaterial erhalten, das in weiteren Anwendungen, wie der Herstellung von Formkörpern, verwendet werden kann. Üblicherweise kann die Temperatur während der Schmelzepolykondensation im Endreaktor etwa 265 bis etwa 305 °C und die Verweilzeit etwa 80 – etwa 240 min. betragen. Übliche Parameter im SSP-Reaktor (davor liegt noch die übliche Kristallisationsstufe) sind: T = 180 - 230 °C; Verweilzeit = 8 - 18 Stunden.

25

In der Kristallisation wird das teilkristalline Polyestermaterial eingesetzt. Es kann jedes Polyestermaterial aus einer Schmelzepolykondensation erhaltene verwendet werden. Das eingesetzte Polyestermaterial kann einen Kristallisationsgrad von bis zu etwa 8%, vorzugsweise etwa 5% bis etwa 8% haben.

30

Der Taupunkt des im erfindungsgemäßen Verfahren während der Kristallisation verwendeten Gases liegt bevorzugt im Bereich von etwa -10 °C bis etwa –80°, insbesondere im Bereich von etwa – 13 °C bis etwa – 78 °C. Der Taupunkt des Gases ist ein Maß für den Wassergehalt des Gases. Die Taupunkte sind auf einen Druck von etwa 1300 mbar bezogen. Das erfindungsgemäß verwendbare Gas hat somit einen Wassergehalt von kleiner etwa 1300 ppm, bevorzugt etwa 1300 ppm bis etwa 0,3 ppm, insbesondere etwa 1100 bis etwa 0,3 ppm.

Als Gas mit einem gewünschten Taupunkt kann jedes kommerziell erhältlich Gas verwendet werden. Bevorzugt erfolgt jedoch eine Befeuchtung des

Gases auf den gewünschten Taupunkt mit einem Teilstrom des mit Feuchtigkeit angereicherten Gases aus dem Verfahren zur Herstellung von Polyestern selbst und/oder durch zusätzliche Befeuchtung mittels eines durch einen Waschturm geleiteten Gasstrom, der dem Hauptgasstrom wieder zugeführt wird. Das eingesetzte feuchte Gas aus dem Prozess

(Kreislaufgas) kann dazu bevorzugt über eine vorhandene Gastrocknung gefahren und damit getrocknet werden. Ein Teilstrom dieses Kreislaufgases kann über einen Bypass abgezweigt und dem Hauptstrom des getrockneten Kreislaufgases zur Taupunkteinstellung wieder zugeführt werden.

- Beispielsweise kann ein feuchtes Gas aus einer der Stufen der Polyesterherstellung, wie der Ver- oder Umesterung, der Schmelze-polykondensation und/oder der SSP, das beispielsweise einen Taupunkt von etwa 10°C hat in zwei Teilströme geteilt werden. Der erste Teilstrom wird getrocknet, wobei dieser nach der Trocknung beispielsweise einen Taupunkt von etwa 70°C hat. Der zweite Teilstrom wird nach dem Trocknen des ersten Teilstroms mit diesem wieder vereinigt. Dadurch wird ein erfindungsgemäß verwendbares Gas mit einem Taupunkt von etwa 35 °C erhalten.
- Das Gas ist bevorzugt Luft, Stickstoff oder ein Gemisch davon, insbesondere Stickstoff.

20

25

30

Mittels Einstellung des Taupunkts des Gases kann das erfindungsgemäße Verfahren so gesteuert werden, dass ein gewünschter Anstieg an Viskosität (I.V.) während der Kristallisation erreicht wird. Mit steigendem Taupunkt und damit Feuchtegehalt des Gases wird der Anstieg an I.V. geringer bis bei einem Taupunkt von etwa – 10 °C im wesentlichen kein Anstieg der Viskosität mehr stattfindet. Der Taupunkt des Gases wird somit um so niedriger gewählt, je höher der Anstieg der I.V. sein soll.

Der gewünschte Anstieg der I.V. liegt bevorzugt bei etwa 0 dl/g bis etwa 0,1 dl/g. Bei einem gewünschten Anstieg der I.V. von etwa 0 dl/g bis etwa 0,02 dl/g liegt der Taupunkt des Gases bevorzugt bei etwa – 10°C bis etwa – 20°C, bei einem gewünschten Anstieg der I.V. von etwa 0,02 dl/g bis etwa 0,04 dl/g bei etwa – 15 °C bis etwa – 25°C, bei einem gewünschten Anstieg der I.V. von etwa 0,04 dl/g bis etwa 0,06 dl/g bei etwa – 20 °C bis etwa – 40°C, bei einem gewünschten Anstieg der I.V. von etwa 0,06 dl/g bis etwa 0,08 dl/g bei etwa – 30°C bis etwa – 55 °C, bei einem gewünschten Anstieg der I.V. von etwa 0,08 dl/g bis 0,1 dl/g bei etwa – 45°C bis etwa – 75 °C.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird in der Schmelzepoly-kondensation ein möglichst niedriger IV – Wert eingestellt und während der Kristallisation über den Tp der Zuwachs der IV (End-IV) gesteuert. Dies hat sich als besonders ökonomisch gute Lösung ergeben. Bei besonderen Anwendungen, bei denen nur sehr geringe oder gar keine IV-Zuwächse erwünscht sind, wird dann ein Gas gewählt, das einen hohen Feuchtegehalt hat, wie mit einem Taupunkt von etwa – 10 °C bis etwa – 15 °C. Dadurch wird kein Zuwachs der I.V. während der Kristallisation erhalten und die IV bleibt konstant. Der Acetaldehydgehalt AA ist < 1 ppm und der Kristallisationsgrad ist >45 %. Dadurch wird eine Polyestermaterial erhalten, das für die anschließende Verarbeitung zu Preforms außerordentlich gut geeignet ist.

Im erfindungsgemäßen Verfahren wird die Kristallisation bevorzugt bei Temperaturen von etwa 150 °C bis etwa 230 °C, bevorzugter etwa 160 –

85318 PCT/EP2005/002003

230 °C, insbesondere etwa 200 °C bis etwa 220 °C durchgeführt. Die Temperatur kann auch während der Kristallisation kontinuierlich um bis zu etwa 20 °C, insbesondere etwa 10 °C, erhöht werden.

- Die Kristallisation wird im erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt bis zu etwa 10 h, insbesondere etwa 2 bis etwa 8 h, lang durchgeführt. Die Kristallisation kann bevorzugt auch kürzer, nämlich etwa 30 bis etwa 120 min., insbesondere etwa 50 bis etwa 80 min. durchgeführt werden.
- Im erfindungsgemäßen Verfahren wird die Kristallisation bevorzugt in wenigstens zwei Stufen, insbesondere zwei Stufen, wie nachstehend beschrieben, durchgeführt. Dabei kann die 1. Stufe der Kristallisation bei einer niedrigeren Temperatur durchgeführt werden als die 2. Stufe der Kristallisation. Insbesondere kann die 1. Stufe der Kristallisation bei einer Temperatur von etwa 150°C bis etwa 210 °C und die 2. Stufe der Kristallisation bei einer Temperatur von etwa 180 °C bis etwa 230 °C durchgeführt wird.

Die Verweilzeit in der 1. Stufe der Kristallisation ist bevorzugt bis etwa 2 h, insbesondere bis etwa 1 h, und in der 2. Stufe bis etwa 8 h, insbesondere 7 – 8 h.

Die 1. Stufe der Kristallisation kann unter Verwendung eines Gasstroms unter Verwirbelung, insbesondere in einem Wirbelbettreaktor, durchgeführt werden. In der 2. Stufe der Kristallisation kann das Polyestermaterial (i) unter mechanischer Störung und Gas im Gegenstrom, (ii) unter mechanischer Störung und Gas im Gleichstrom und (iii) ohne mechanische Störung und Gas im Gleichstrom fließen. Dazu kann bevorzugt die 2. Stufe der Kristallisation in einem Schachtkristallisator durchgeführt werden.

30

20

25

Zum Bereitstellen des Polyestermaterials in der 1. Stufe dieser Ausführungsform der Kristallisation in zwei Stufen, kann jedes geeignete

15

20

25

30

PCT/EP2005/002003

teilkristalline Polyestermaterial in Kugel- oder zylindrischer Form verwendet werden. Das teilkristalline Polyestermaterial kann durch Kristallisieren eines aus der Schmelzepolykondensation erhaltenen Polyestermaterials erhalten werden. Bevorzugt kann, um das Polyestermaterial in der 1. Stufe der Kristallisation bereitzustellen, teilkristallines Polyestermaterial erhältlich nach der Schmelzepolykondensation, vorzugsweise Granulat, in der 1. Stufe zur Erhöhung des Kristallisationsgrad auf etwa 42 bis etwa 50% unter Verwirbelung mit einem Gasstrom bei geeigneten Temperaturen und Verweilzeiten behandelt werden. Bevorzugte Temperaturen liegen im Bereich von etwa 195 bis etwa 210 °C und bevorzugte Verweilzeiten betragen von bis zu etwa 60 min., vorzugsweise etwa 20 bis etwa 55 min.

Das zur Verwirbelung verwendete Gas ist vorzugsweise Luft und/oder Stickstoff. Der Taupunkt des Gases kann zwischen -75 bis -10 °C variieren.

Die Herstellung des teilkristallinen Polyestermaterials kann mittels eines Wirbelbettreaktors durchgeführt. Insbesondere bevorzugt wird die 1. Stufe der Kristallisation in zwei Zonen durchgeführt, wobei die Kristallisation in der ersten Zone 1 in einem Wirbelbett mit Mischcharakteristik und in der zweiten Zone 2 in einem Wirbelbett mit kontrollierter Granulatströmung durchgeführt wird.

Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform eines Wirbelbettreaktors 20, mit dem die Kristallinität eines Polyester-Granulats auf den gewünschten Grad, insbesondere auf 40 bis 48%, erhöht wird. Dabei wird das Granulat über ein Förderorgan 10 in einen mit rechteckigen Fluidisierungsflächen ausgestatteten Wirbelbettkristallisator 20 mit zwei Zonen 30,50 geführt, in dem das Granulat unter ansteigenden Temperaturen von 170 — 210 °C, insbesondere 190 — 210 °C, und Gas mit einem Taupunkt von – 10 °C bis – 78 °C, insbesondere – 10 °C bis –50 °C, kristallisiert wird.

Das Gas/Chipsverhältnis kann in der ersten Zone 2-4 und in der zweiten Zone 2-3, bei einer Verweilzeit von bis zu 60 min, vorzugsweise 20 – 35

min., betragen.

20

25

Die Gasführung kann in der Art erfolgen, dass das Gas über ein Lochblech verteilt, in die erste Zone 30 über eine Gaseinlassöffnung 40 mit einer Gasgeschwindigkeit von 3,2 — 4 m /sec und in die zweite Zone 50 über eine Gaseinlassöffnung 40' mit einer Gasgeschwindigkeit von 2,1 – 3,5 m/sec. gelangt (Leerraumgeschwindigkeit) und über einen gemeinsamen Gasaustritt 60 im oberen Bereich den Kristallisator 20 wieder verlässt. Diese Art der Gasführung führt in der ersten Zone 30 zu einem Wirbelbett mit Mischcharakteristik und in der zweiten Zone 50 zu einer Verwirbelung mit kontrollierter Granulatströmung. Der Staubanteil am Austritt des Kristallisators beträgt < 20 ppm.

Das nach der 1. Stufe der Kristallisation erhaltene Granulat hat vorzugsweise einen Kristallisationsgrad im Chip von etwa 42 - 50 %.

Das nach der 1. Stufe erhaltene, teilkristalline Polyestermaterial, vorzugsweise Granulat, fließt in einer 2. Stufe bei für die Kristallisation geeigneten Temperaturen (i) unter geringer mechanischer Störung und Gas im Gegenstrom, (ii) unter mechanischer Störung und Gas im Gleichstrom, und (iii) ohne mechanische Störung und Gas im Gleichstrom.

Die Stufen (i) bis (iii) der 2. Stufe der Kristallisation werden besonders bevorzugt kontinuierlich durchgeführt, d.h. das Polyestermaterial durchläuft die Stufen (i) bis (iii) im einem kontinuierlichen Strom.

Das in der 2. Stufe (i) bis (iii) verwendete Gas ist vorzugsweise Luft oder Stickstoff, insbesondere Stickstoff.

Die in der 2. Stufe (i) bis (iii) für die Kristallisation geeignete Temperatur beträgt vorzugsweise etwa 190 bis etwa 220 °C, bevorzugter 195 bis 215 °C, und insbesondere 208 bis 213 °C.

WO 2005/085318

15

20

25

30

Die Verweilzeit des Polyestermaterials in der 2. Stufe (i) beträgt vorzugsweise etwa 30 bis etwa 60 min., in der 2. Stufe (ii) etwa 30 bis etwa 60 min., und in der 2. Stufe (iii) etwa 180 bis etwa 300 min.

- Insbesondere bevorzugt wird die 2. Stufe der Kristallisation in drei Zonen eines Schachtkristallisators durchgeführt, nämlich Zone 3, 4 und 5, in denen die Schritte (i) bis (iii) der 2. Stufe durchgeführt werden. In Zone 3 wird das Granulat unter periodisch auftretenden mechanischen Störungen mit Gas im Gegenstrom, in der Zone 4 unter periodisch auftretenden mechanischen Störungen mit Gas im Gleichstrom und in Zone 5 keiner mechanischen Störung und Gas im Gleichstrom unterworfen.
 - Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform für einen erfindungsgemäß verwendbaren einen Schachtkristallisator 70, in dem die 2. Stufe der Kristallisation durchgeführt werden kann. Das Granulat wird in der 2. Stufe, wie in Fig. 2 dargestellt, in einen kontinuierlich arbeitenden, senkrecht stehenden dreiteiligen Schachtkristallisator 70 mit einer, in der Längsachse installierten zentrierten drehbaren Welle 170 eingebracht. Im ersten und zweiten Abschnitt 80, 90 des Schachtkristallisators, Zone 3 und 4, sind Arme 180, 180' mit geringem Strömungswiderstand in bestimmten Abständen an der Welle angebracht, durch die eine periodische mechanische Störung des Schüttgutes erreicht wird. Aufgrund der Granulatbewegung wird eine Agglomeratbildung (Verklebung) des Materials verhindert. Im dritten Abschnitt 100 des Schachtkristallisators wird das Granulat in Zone 5 ohne Störung behandelt.

In der 3. und 4. Zone wird das Granulat periodisch mechanisch gestört, während in der 5. ungestörten Zone eine Verweilzeitvergleichmäßigung bei beginnender Postpolykondensation stattfindet.

Die Gasführung erfolgt in der Art, dass das Gas zwischen der 3. und 4. Zone (erster und zweiter Abschnitt des Schachtkristallisators) über eine Gaseinlassöffnung 140 zugeführt wird und den Kristallisator im oberen bzw.

ersten Abschnitt 80 über eine Gasaustrittsöffnung 150 und anteilmäßig auch unteren bzw. dritten Abschnitt 100 über eine Gasaustrittsöffnung 160 wieder verlässt. Dabei wird das Gas in der 3. Zone (erster Abschnitt des Schachtkristallisators) im Gegenstrom zum Granulat und in der 4. und 5.

12

Zone im Gleichstrom (zweiter und dritter Abschnitt des Schachtkristallisators) geführt.

Die Gasaustrittöffnungen (150, 160) sind dabei bevorzugt so angeordnet, dass das durch die Gaseintrittöffnung (140) eingeleitete Gas möglichst lange mit dem Granulat im Gegen- bzw. im Gleichstrom geführt wird, d.h. am Anfang des ersten Abschnitts (80) und am Ende des dritten Abschnitt (100) des Schachtkristallisators (70).

In der 3. Zone (erster Abschnitt 80 des Schachtkristallisators 70) wird das PET-Granulat unter periodisch einwirkender mechanischer Störung bevorzugt mittels heißem Gas, insbesondere Stickstoff, im Gegenstrom zum Granulat mit einem Gas-Schnitzelverhältnis von 1-3 und einer Verweilzeit von 30-60 min. auf 190-220 °C aufgeheizt.

In der 4. Zone (zweiter Abschnitt 90 des Schachtkristallisators 70) wird das PET unter periodisch einwirkender mechanischer Störung bevorzugt bei 190-220 °C mit dem Gas, insbesondere Stickstoff, im Gleichstrom bei einem Gas-Chip-Verhältnis von 0.5-1 weiter kristallisiert und vergleichmässigt. Die Verweilzeit beträgt 30-60 min.

25

30

10

15

Das in der 3. und 4. Zone auf diese Weise behandelte PET-Granulat wird bevorzugt in der ungestörten 5. Zone (Abschnitt 100 des Schachtkristallisators 70) bei einer Temperatur von 190-215 °C im Gleichstrom mit einem Gas/Schnitzel-Verhältnis von 0.1-3 in der Weise behandelt, dass bei einer mittleren Verweilzeit von 60-180 min., neben der Aldehyd-Reduzierung und Kristallisation, hier in Abhängigkeit der Feuchtigkeit des Gases nach dem erfindungsgemäßen Verfahren eine Postpolykondensation zwischen 0 – 0,10 dl/g l.V. – Zunahme gezielt

stattfindet.

5

10

15

20

25

30

In der 3. und 4. Zone wird das Granulat periodisch mechanisch gestört, während in der 5. ungestörten Zone eine Verweilzeitvergleichmäßigung bei beginnender Postpolykondensation stattfindet.

Die Gasführung erfolgt in der Art, dass das Gas zwischen der 3. und 4. Zone (erster und zweiter Abschnitt des Schachtkristallisators) über eine Gaseinlassöffnung zugeführt wird und den Kristallisator im oberen bzw. ersten Abschnitt über eine Gasaustrittsöffnung und anteilmäßig auch unteren bzw. dritten Abschnitt über eine Gasaustrittsöffnung wieder verlässt. Dabei wird das Gas in der 3. Zone (erster Abschnitt des Schachtkristallisators) im Gegenstrom zum Granulat und in der 4. und 5. Zone im Gleichstrom (zweiter und dritter Abschnitt des Schachtkristallisators) geführt.

Die Gasaustrittöffnungen sind dabei bevorzugt so angeordnet, dass das durch die Gaseintrittöffnung eingeleitete Gas möglichst lange mit dem Granulat im Gegen- bzw. im Gleichstrom geführt wird, d.h. am Anfang des ersten Abschnitts und am Ende des dritten Abschnitt des Schachtkristallisators.

Die Gesamtverweilzeit des Polyestermaterials in der 1. und 2. Stufe der Kristallisation, wenn diese die vorstehend beschriebenen die Zonen 1 bis 5 umfasst, beträgt vorzugsweise zwischen 290 - 480 min., insbesondere 350 — 450 min., wobei das Verweilzeitverhältnis, in der 1. Stufe im Vergleich zur Verweilzeit in der 2. Stufe 1: 4 bis 1: 21 ist. Insbesondere bevorzugt beträgt das Verweilzeitverhältnis in der 1. und 2. Stufe der Kristallisation, wenn diese Stufen die Zonen 1 bis 5 umfassen, eine Verweilzeit in den Zonen 3 und 4, die 1- bis 6-mal so lange ist, wie in den Zonen 1 und 2 und eine Verweilzeit in der Zone 5, die 1,5- bis 5-mal so lange ist, wie in den Zonen 3 und 4.

Das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Polyestermaterial hat bevorzugt eine I.V. von etwa 0,3 dl/g bis etwa 0,9 dl/g, bevorzugt etwa 0,3 dl/g bis 0,8 dl/g, besonders bevorzugt etwa 0,66 dl/g bis 0,9 dl/g, insbesondere etwa 0,72 bis 0,8 dl/g. Insbesondere bevorzugt wird ein Polyestermaterial eingesetzt, das eine I.V. von mindestens etwa 0,66 dl/g, bevorzugter etwa 0,66 bis 0,8 dl/g und insbesondere etwa 0,72 bis 0,8 dl/g hat, da das dabei erhaltene Material einen gewünscht niedrigen Gehalt an Acetaldehyd aufweist, nämlich < 10 ppm, insbesondere < 1 ppm, und daher geeignet ist, ohne anschließende SSP zu Polyesterformkörpern, bei denen ein niedriger Acetaldehydgehalt erforderlich ist, wie Flaschen, weiterverarbeitet zu werden.

PCT/EP2005/002003

Überraschend wurde gefunden, dass beim Durchführen des erfindungsgemäßen Verfahrens die I.V. des Polyestermaterials mittels
Feuchte im Gas gesteuert werden kann und somit ein Granulat gezielt hergestellt werden kann, welches den entsprechenden
Flaschenapplikationen entspricht, wobei ein Granulat mit einer hohen I.V. eingesetzt werden kann.

Wenn Polyestermaterial mit einer I.V. von mindestens etwa 0,3 dl/g bis etwa 0,72 dl/g eingesetzt wird, wird vorzugsweise danach eine SSP durchgeführt.

Da teilkristalliner Polyester während der Kristallisation im Kristallisator und im folgenden Festphasenpolykondensationsreaktor durch eine hohe exotherme Wärmeentwicklung zu erhöhter Agglomeratbildung neigen kann und diese Verklebungen so stark sein können, dass sie sich bei der Anwendung üblicher Kristallisations- und Festphasenpolykondensationsverfahren nicht mehr voneinander lösen, ist es bevorzugt, im erfindungsgemäßen Verfahren kugelförmiges Polyestermaterial einzusetzen. Es können jedoch auch andere Granulatformen eingesetzt werden, wie

zylinderförmiges oder schuppenförmiges Granulat.

25

30

PCT/EP2005/002003

Zylindrischen Granulate sind jedoch nicht bevorzugt, da sie wegen der Flächen und Kanten leichter verkleben und der Abrieb größer ist. Durch die Asymmetrie der zylindrischen Chips ist eine gleichmäßige Kristallisation vom Mantel zum Kern des Chips schwierig. Der Einsatz von annähernd kugelförmigen Chips hat im Vergleich zum gleichgewichtigen zylindrischen Chip die Vorteile einer gleichmäßigeren Kristallisation, einer einheitlicheren Molmassenverteilung im Chip und eines 5 - 10 % höheren Schüttgewichts. Als weiterer wesentlicher Vorteil ist der bei Verwendung von kugelförmigen Chips niedrigere anfallende Staubanteil zu sehen.

10

20

Insbesondere bevorzugt hat das eingesetzte Granulat eine Oberfläche von $1,45 - 2.0 \text{ m}^2/\text{kg}$, vorzugsweise 1.6 bis 1.8 m²/kg.

Das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erhaltene Granulat hat vorzugsweise einen einheitlichen Kristallisationsgrad von etwa 53 bis etwa 15 55 %, vorzugsweise 54 %.

Das erfindungsgemäß erhaltene Granulat hat vorzugsweise einen Acetaldehydgehalt von <10 ppm, besonders bevorzugt 0.5 - 5 ppm und insbesondere < 1 ppm.

Der Staubanteil des Granulats beträgt < 20 ppm, vorzugsweise nach der erfindungsgemäßen Kristallisation <10 ppm.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß bei der Anwendung des 25 erfindungsgemäßen Verfahrens unter Verwendung eines Gases mit einem Taupunkt von kleiner gleich – 10 °C, insbesondere durch Verwendung einer Wirbelbett- und Schachtkristallisation, ein Polyestergranulat mit geringem Acetaldehydwert, geringer Acetaldehydreformation, hervorragender Farbbrillanz, sehr kleinen Staubwerten, ohne Verklebungen und beim Ein-30 satz von Chips mit hohen I.V. zwischen 0.66 - 0.90 dl/g aus der Schmelzepolykondensation, wobei auf eine anschließende Festphasenpolykondensation verzichtet werden kann, hergestellt werden

kann. Außerdem kann der Acetaldehydgehalt von 50 - 30 ppm auf 5 - 7 ppm reduziert werden.

Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung von Polyesterformkörpern, wobei Polyestermaterial, insbesondere Granulat, erhältlich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren mit einer I.V. – Erhöhung zwischen 0 – 0,10 dl/g ohne Festphasenpolykondensation verwendet wird. Polyestermaterial kann somit nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ohne Durchführen einer Festphasenpolykondensation zum Herstellen der Polyesterformkörper verwendet werden, was wegen der geringeren Kosten und geringerem apperativen und energetischen Aufwand vorteilhaft ist.

Insbesondere kann Polyestermaterial, besonders in Form von Granulat oder Chips, das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt wurde und mit einer I.V. aus der Schmelzepolykondensation von > 0.66 dl/g, direkt ohne weitere Aufkondensation in einem Festphasenpolykondensationsreaktor der Verarbeitung im Streckblas- oder Spritzstreckblasverfahren zur Herstellung der Polyesterformkörper zugeführt werden. Der besondere Vorteil liegt in deutlichen besseren Aufschmelzeigenschaften bei der Verarbeitung des Granulats zu Preforms. Die notwendige Schmelzenergie liegt mit Werten unter < 56 kJ/kg, vorzugsweise 50 – 52 kJ/kg. Der Schmelzpunkt, gemessen nach DSC ohne vorheriges Aufschmelzen (DSCO) liegt bei um 242 – 244 °C in einem sehr günstigen Bereich für die Verarbeitung zu Preforms und Flaschen.

25

10

15

20

Die Polyesterformkörper sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Flaschen, Folien, Filmen, Filamenten, Fasern und technischen hochfesten Fäden.

Die Erfindung wird nunmehr anhand einiger, in keiner Weise die Erfindung beschränkender Ausführungsbeispiele näher beschrieben. Die angegebenen Eigenschaftswerte wurden hierbei wie folgt ermittelt:

Die Intrinsic-Viskosität (I.V.) wurde bei 25 °C an einer Lösung von 500 mg Polyester in 100 ml eines Gemisches aus Phenol und 1 2-Dichlorbenzol (3:2 Gew.-Teile) gemessen.

5

Die COOH-Endgruppenkonzentration wurde mittels photometrischer Titration mit 0,05 ethanolischer Kalilauge gegen Bromthymolblau einer Lösung eines Polyesters in einem Gemisch aus o-Kresol und Chloroform (70:30 Gew.-Teile) bestimmt.

10

15

20

Die Bestimmung von Diethylenglykol (DEG), Isophthalsäure (IPA) und 1,4-Cyclohexandimethanol (CHDM) im Polyester erfolgt mittels
Gaschromatographie nach vorangegangener Methanolyse von 1 g Polyester in 30 ml Methanol unter Zusatz von 50 mg/l Zinkacetat im Bombenrohr bei 200 °C.

Die Messung des Trübungswertes in "nephelometrischen Trübungseinheiten" (NTU) erfolgte an einer 10 Gew.-%-igen Lösung von Polyester in Phenol/ Dichlorbenzol (3:2 Gew.-Teile) mit einem Nephelometer der Fa. Hach (Typ XR, nach US-Patent 4 198 161) in einer Küvette mit 22,2 mm Durchmesser in Analogie zu der für Wasser gebräuchlichen Norm DIN 38404, Teil 2. Gemessen wird die Intensität des Streulichtes im Vergleich zu einer Formazin-Standardlösung abzüglich des Wertes vom Lösungsmittel (ca. 0,3 NTU).

25

30

Die Messung der Farbwerte L und b erfolgte nach HUNTER. Die Polyesterchips wurden zunächst im Trockenschrank bei 135 ± 5 °C während einer Stunde kristallisiert. Die Farbwerte wurden danach ermittelt, indem in einem Dreibereichfarbmeßgerät der Farbton der Polyesterprobe mit drei Fotozellen, denen je ein Rot-, Grün- und Blaufilter vorgeschaltet war, gemessen wurde (X-, Y- und Z-Werte): Die Auswertung erfolgte nach der Formel von HUNTER, wobei

$$L = 10 \sqrt{Y}$$
 und

$$b = \frac{7.0}{\sqrt{Y} (Y - 0.8467 Z)}$$

5 ist.

10

20

Der Acetaldehydgehalt (AA) wurde bestimmt, indem der Acetaldehyd durch Erhitzen in einem geschlossenen Gefäß aus Polyester ausgetrieben wurde und der Acetaldehyd im Gasraum des Gefäßes gaschromatographisch mit dem Head space-Injektionssystem H540, Perkin Elmer; Trägergas: Stickstoff; Säule: 1,5 m Edelstahl; Füllung: Poropack Q, 80 — 100 mesh; Probemenge: 2g; Heiztemperatur: 150 °C. Heizdauer: 90 min. bestimmt wurde.

- Die Staubanalyse wird gravimetrisch durchgeführt. Dazu werden 1 kg Chips mit Methanol gewaschen, das Waschmittel über ein Filter abfiltriert und der Rückstand getrocknet und gewogen.
 - Das Produkt wird eingewogen und von einer Anfangstemperatur um 35 °C mit einer Heizrate von 10 K / min auf 300 °C erwärmt und anschließend der Schmelzpunkt und die für den Aufschmelzvorgang benötigte Schmelzenergie ermittelt (DSCO entspricht der DSC (Differential Scanning Calorimetry)-Methode, jedoch ohne vorheriges Aufschmelzen der Probe).
- Die Oligomerenbestimmung im PET erfolgt durch Lösung in einer Mischung aus 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol (HFIP)/ Chloroform. Das hochmolekulare PET wird mittels Methanol gefällt, abfiltriert und die Lösung unter Vakuum getrocknet. Anschließend wird der Oligomerenrückstand erneut in einer Standardlösung, bestehend aus Toluol in HFIP / Chloroform in Lösung gebracht und mittles Gel Permeation Chromatography (GPC) der Oligomerengehalt bestimmt.

Zur Bestimmung des Kristallisationsgrades (KTG) wird dreimal die Dichte von 30 Chips in einem Dichtegradienten mit einem Tetrachlorethan/Heptan-Gemisch bei 23 °C ermittelt und berechnet nach

Die Ermittlung der Schmelzenthalpie (Heat of Fusion; HOF) erfolgt getrennt 5 von der DSCO - Analyse in der Weise, dass die PET - Einwaage in 50 K -Schritten bis auf 200 °C erwärmt, 5 min. gehalten und anschließend mit 10 K / min. bis auf 300 °C erhitzt wird und die verbrauchte Energie in kJ/kg zu bestimmen ist.

10

Beispiel 1 (Vergleich)

Im Beispiel 1 wurden amorphe Kugelchips mit einem Gewicht von 15,5 mg / Chips und mit einer Oberfläche von 1.55 m²/kg, einem Schüttgewicht von 840 kg/m³ und einer I.V. von 0.612dl/g, aus dem Schmelzepoly-15 kondensationsverfahren zur Herstellung von leicht modifiziertem PET für Flaschen für die Befüllung mit Süßgetränken kristallisiert und festphasenpolykondensiert.

Einsatzmaterial im Beispiel 1 20 Katalysatorgehalt Sb: 200 ppm, IPA: 2 Ma-%, DEG: 1,4 Ma-%

Die Ergebnisse des Beispiels 1 werden in der Tabelle 1 und die Ergebnisse aus dem Beispiel 2 – 4 in Tabellen 2 - 4 und in der Anlage 1 dargestellt.

Tabelle1, Beispiel 1
(Standardkristallisation mit nachfolgender SSP, Taupunkt -75°C im SSP-Reaktor)

Analysen	Einsatzmaterial Kugelförmige Chipsform	1. Kristallisation (Zone 1 und 2) Wirbelbettkristallisator VWZ: 60min. T: 200°C	2. Kristallisation Schachtkristallisa- tor (Zonen 3 bis 5) VWZ: 180min. T: 215°C	SSP VWZ: 12Std. T: 207.5°C Delta I.V.= 0.240[dl/g]
I.V. [dl/g]	0.60	0.62	0.64	0.84
COOH	30	27	26	26
[mmol/kg]				244
DSCO [°C]	-	•		
Farbe L	83	85.1	88.1	89.4
Farbe b	-3.3	-1.0	-0.6	-0.6
AA [ppm]	55	8.8	1	0.2
KTG [°C]	-	46.1	53.1	55.2
HOF [kJ/kg]				58.6
Oligomere [%]	-			0,6
Staub [ppm]	·< 10	-	-	< 20

Im Beispielen 2 - 4 wurden amorphe Kugelchips mit einem Gewicht von 14 mg / Chip und mit einer Oberfläche von 1.61 m²/kg, einem Schüttgewicht von 880 kg/m³ und einer I.V. von 0.74 – 0,76 dl/g, aus dem Schmelzepolykondensationsverfahren nach dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt.

10

Im Beispiel 2 wurden diese Chips bei einem Taupunkt von -75 °C, -30 °C und -15 °C im Trägergas Stickstoff, einer Verweilzeit von 7,6 Stunden bei Temperaturen zwischen 205 und 213 °C kristallisiert.

Einsatzmaterial im Beispiel 2:

Katalysatorgehalt Sb: 250 ppm, IPA: 2 Ma-%, DEG: 1,4 Ma-%,

Beispiel 2

Tabelle2, Beispiel 2 (Kristallisation bei einem Taupunkt von -75 / -30 / -15 °C im Gaskreislauf)

Analysen	Einsatzmaterial Kugelförmige Chipsform	1.Kristallisation (Zonen 1 und 2) Wirbelbettkristallisator VWZ: 52min. T: 205°C Tp Gas -75 /-30/-15°C	2. Kristallisation (Zonen 3 bis 5) Schachtkristallisator VWZ: 403 min. T: 213°C Tp Gas -75 /-30 / -15 °C
I.V. [dl/g]	.0.76	0.73 - 0.74	0.87 / 0.82 / 0.76
COOH			14/19/20
[mmol/kg]	25	-	0.40 / 0.40 / 0.20
DSCO [°C]	-	<u> </u>	243 / 242 / 239
Farbe L	81	<u>-</u>	85
Farbe b	-3	-	0-0,5
AA [ppm]	42	5 – 6	0,7/0.6/0.5
KTG [°C]	-	48 – 50	54
HOF [kJ/kg]	-	-	57.5 / 54.2 / 54.3
Oligomere	-	-	
[%]			0.8
NTU	6.5	· -	2 – 4
Staub [ppm]	< 10	•	13.7

In einem weiteren Beispiel 3 wurden amorphe Kugelchips nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bei einem Taupunkt von -39, °C, -30 °C, -17 °C im Trägergas Stickstoff, einer Verweilzeit von 7,6 Stunden bei Temperaturen zwischen 205 und 213 ° kristallisiert.

10

5

Einsatzmaterial im Beispiel 3 und 4:

Katalysatorgehalt Sb: 220 ppm, IPA: 2 Ma-%, DEG: 1,4 Ma-%

Beispiel 3

Tabelle 3, Beispiel 3 (Kristallisation bei einem Taupunkt von -39 / -30 / -17 °C im Gaskreislauf)

Analysen	Einsatzmaterial Kugelförmige Chipsform	1.Kristallisation (Zonen 1 und 2) Wirbelbettkristallisator VWZ: 52min. T: 205°C Tp Gas -39 /-30/-17°C	2. Kristallisation (Zonen 3 bis 5) Schachtkristallisator VWZ: 403 min. T: 213°C Tp Gas -39 /-30 / -17°C
LV. [dl/g] .	0.74-0.75	0.73 - 0.74	0.82 / 0.80 / 0.76
COOH		-	15/17/22
[mmol/kg]	20		242 / 242 / 242
DSCO [°C]	-	-	243 / 240 / 240
Farbe L	80	<u> </u>	86
Farbe b	-3	<u>-</u>	0 - 0.5
AA [ppm]	35	5	0.5 – 0.6
KTG [°C]	-	48 – 50	55
HOF [kJ/kg]	-	-	. 54 – 56
Oligomere [%]	-	-	0.9 – 1.0
NTU.	3 - 5	-	2
Staub [ppm]	< 10	-	15.4

Im Beispiel 4 wurden amorphe Kugelchips nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bei einem Taupunkt von -39 im Trägergas Stickstoff, einer verringerten Verweilzeit von 6,7 Stunden bei Temperaturen zwischen 205 und 213 ° kristallisiert.

10

5

Beispiel 4

Tabelle 4, Beispiel 4 (Kristallisation bei einem Taupunkt von -39 °C im Gaskreislauf bei verkürzter Verweilzeit)

Analysen	Einsatzmaterial Kugelförmige Chipsform	1.Kristallisation (Zonen 1 und 2) Wirbelbettkristallisator VWZ: 46min. T: 205°C Tp Gas – 39 °C	2. Kristallisation (Zonen 3 bis 5) Schachtkristallisator VWZ: 353 min. T: 213°C Tp Gas -39 °C
I.V. [dl/g]	0.74	0.73	0.81
СООН		-	
[mmol/kg]	20		
DSCO [°C]	-	-	96
Farbe L	81	-	86
Farbe b	-3	-	-0.5
AA [ppm]	32	7	0.6
KTG [°C]	-	48	54
HOF [kJ/kg]	-	-	52.4
Oligomere	-	-	1.03
[%]			
NTU	3,3	-	4.1
Staub [ppm]	< 10	-	11.9

Fig. 3 zeigt eine Reaktionskurve der I.V. – Entwicklung in Abhängigkeit der eingestellten Taupunkte des Gases bei gleichbleibender Antimonkonzentration im PET und bei einer Verweilzeit in der Kristallisation

10

von 445 min.

5

Die Granulat wurde bei 180 °C über 4 Stunden in einem Challenger Trockner für die Prefromherstellung vorbereitet.

Die Verarbeitung zu Preforms erfolgte an einer Produktionsmaschine vom
Typ Husky XL300P / 48 Kavitäten zu 28 g Preforms bei 295 °C beim
Vergleichsprodukt und unter Temperaturabsenkung im Hotrunner auf 270 275 °C bei der Verarbeitung der Chips aus dem erfindungsgemäßen
Verfahren.

20 Die Flaschenherstellung wurde an einer Labormaschine von Sidel mit einem

Werkzeug mit Coca Cola Design unter Standardbedingungen hergestellt.

Die Preform- und Flaschenherstellung verlief problemlos. Die Transparenz der Flaschen war gut und farbneutral. Der Acetaldehydgehalt nach der üblichen Headspacemethode lag bei den Flaschen nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zwischen 1.0 — 2.5, Mittelwert 1.9 μg/l im Vergleich zu den Flaschen nach der herkömmlichen Festphasenpolykondensation mit 2.5 – 3.1 μg/l. Die mechanischen Eigenschaften der Flaschen unterschieden sich nicht.

20

25

Patentansprüche

- Verfahren zum Herstellen von Polyestern, umfassend eine Kristallisation eines Polyestermaterials, wobei die Kristallisation in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt von (kleiner gleich) ≤ 'etwa – 10 °C durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Taupunkt im Bereich von etwa
 -10 °C bis etwa 85 °C liegt.
 - Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Gas Luft, Stickstoff oder ein Gemisch davon ist.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Gas Stickstoff ist.
 - 5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Intrinsische Viskosität I.V. des Polyestermaterials während der Kristallisation um etwa 0 bis etwa 0,11 dl/g ansteigt.
 - Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Taupunkt des Gases in Abhängigkeit von dem gewünschten Anstieg an I.V. eingestellt wird.
 - 7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche wobei die Kristallisation bei Temperaturen von etwa 150 °C bis etwa 230 °C durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Temperatur während der Kristallisation kontinuierlich um bis zu etwa 20 °C erhöht wird.

15

20

30

·. :

- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Kristallisation bis zu etwa 10 h durchgeführt wird.
- 5 10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Kristallisation in wenigstens zwei Stufen durchgeführt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 10, wobei die 1. Stufe der Kristallisation bei einer niedrigeren Temperatur durchgeführt wird als die 2. Stufe der Kristallisation.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei die 1. Stufe der Kristallisation bei einer Temperatur von etwa 150°C bis etwa 210 °C und die 2. Stufe der Kristallisation bei einer Temperatur von etwa 180 °C bis etwa 230 °C durchgeführt wird.
 - 13. Verfahren nach einem der Ansprüchen 10 bis 12, wobei die 1. Stufe der Kristallisation bis etwa 2 h und die 2. Stufe bis etwa 8 h durchgeführt wird.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die 1. Stufe der Kristallisation unter Verwendung eines Gasstroms unter Verwirbelung durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 14, wobei die 1. Stufe der Kristallisation in einem Wirbelbettreaktor durchgeführt wird.
 - 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei in der 2 Stufe der Kristallisation das Polyestermaterial (i) unter mechanischer Störung in Gas im Gegenstrom, (ii) unter mechanischer Störung und Gas im Gleichstrom und (iii) ohne mechanische Störung und Gas im Gleichstrom fließt.

- 17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei die 2. Stufe der Kristallisation in einem Schachtkristallisator durchgeführt wird.
- Verfahren zum Herstellen eines Polyesterformkörpers, wobei
 Polyestermaterial, erhältlich mit einem Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche verwendet wird.
 - 19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei der Polyesterformkörper ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Flaschen, Folien, Filmen, Filamenten, Fasern und technischen hochfesten Fäden.

15

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 oder 19, wobei Polyestermaterial ohne Durchführen einer Festphasenpolykondensation in einer anschließenden Reaktionsstufe zum Herstellen der Polyesterformkörper verwendet wird.

÷. ,

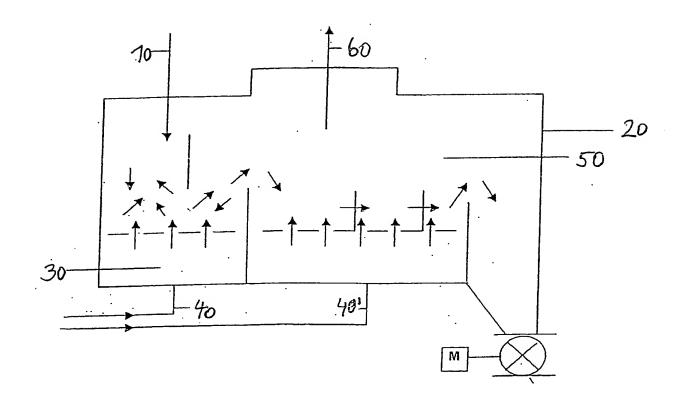


Fig. 1

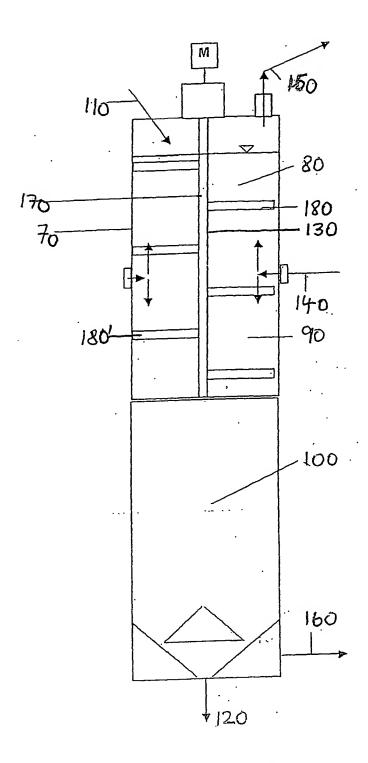


Fig. 2

WO 2005/085318 PCT/EP2005/002003

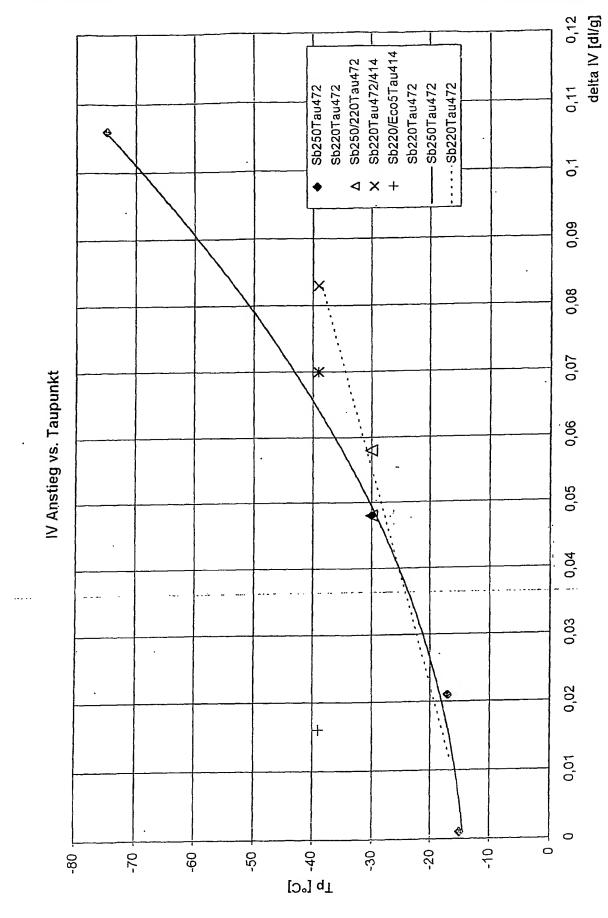


Fig. 3



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08G63/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC\ 7\ C08G$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Category °	Citation of document, with indication. where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WO 2004/055093 A (BUEHLER AG; CHRISTEL, ANDREAS; CULBERT, BRENT, ALLAN) 1 July 2004 (2004-07-01) the whole document	1-20
Х	WO 03/085026 A (EUROTECNICA DEVELOPMENT & LICENSING S.P.A; CODIGNOLA, FRANCO) 16 October 2003 (2003-10-16) the whole document	1-20
X	WO 03/033581 A (TEIJIN LIMITED; NAKAO, TAKUO; CHIKATSUNE, TETSUYA; NAKASHIMA, MINORU;) 24 April 2003 (2003-04-24) the whole document	1-20
X	US 2002/094402 A1 (JEN ZO-CHUN) 18 July 2002 (2002-07-18) the whole document	1-20

	-/-
Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed 	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an Inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to Involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 9 June 2005	Date of mailing of the International search report 15/06/2005
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Glomm, B



International Application No
PCT/EP2005/002003

		PCI/EP200	3/002003			
.(Continua	Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.			
X	EP 1 273 610 A (MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) 8 January 2003 (2003-01-08) the whole document		1-20			
X	US 2002/128427 A1 (SCHAAF ECKEHART ET AL) 12 September 2002 (2002-09-12) the whole document		1-20			
X	US 2003/139543 A1 (WILHELM FRITZ ET AL) 24 July 2003 (2003-07-24) the whole document		1-20			
X	US 2002/032300 A1 (DOWLING CONOR M ET AL) 14 March 2002 (2002-03-14) the whole document		1–20			
X	EP 0 939 095 A (MITSUI CHEMICALS, INC) 1 September 1999 (1999-09-01) the whole document		1–20			
X .	US 5 968 429 A (TREECE ET AL) 19 October 1999 (1999-10-19) the whole document		1-20			
			·			
	·					
·						
	,					
			·			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP2005/002003

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. 🔀	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: see FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/210
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This inte	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No. PCT/EP2005/002003

Continuation of Box II.2

The current claims 1 to 20 relate to processes characterised in each case by a desirable attribute or property, namely a parameter as specified to the last two lines of claim 1 ("in the presence of a gas with a dew point temperature of..."). The claims therefore cover all processes that have this attribute or property, yet only a limited number of processes of this type have adequate support in the description (PCT Article 5). In this instance the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the full range of subject matter for which protection is sought. Irrespective of this, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) because they attempt to define the process in terms of the results which are to be achieved. This lack of clarity too is such that it is impossible to carry out a meaningful search covering the full range of subject matter for which protection is sought. The search was therefore directed to the parts of the claims that appear to be clear, supported and disclosed in the above sense, that is the parts relating to the processes according to examples 1 to 4, which are defined in the description as preferred embodiments of the invention.

The applicant is advised that claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established cannot normally be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subject matter that has not been searched. This also applies in cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry into the regional phase before the EPO an additional search may be carried out in the course of the examination (cf. EPO Guidelines, C-VI, 8.5) if the deficiencies that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been corrected.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2005/002003

	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
MO	2004055093	Α	01-07-2004	DE	10259694 A	1 01-07-2004
	200	••		AU	2003269668 A	1 09-07-2004
				WO	2004055093 A	
WO	03085026	Α	16-10-2003	ΙT	MI20020734 A	
				AU	2003229628 A	
				WO	03085026 A	1 16-10-2003
				EP	1492835 A	1 05-01-2005
MU 	03033581		24-04-2003	 JP	2003119316 A	23-04-2003
WO	03033301	^	24 04 2005	JP	2003113510 A	08-05-2003
				JΡ	2003128600 A	08-05-2003
				JP	2003120000 A 2003160651. A	
						03-06-2003
				JP	2003160652 A	03-06-2003
			•	JP	2003160653 A	03-06-2003
				JP	2003160654 A	03-06-2003
				CN	1571810 A	26-01-2005
				EP	1437377 A	
				MO	. 03033581 A	
				MX	PA04003380 A	21-06-2004
				TW	591049 B	11-06-2004
				US	2005004390 A	
US	2002094402	A1	18-07-2002	JP	2002226568 A	14-08-2002
EP	1273610	Α	08-01-2003	JP	2002226563 A	14-08-2002
				EP.	1273610 A	1 08-01-2003
				US	2003109667 A	
				US	2004044173 A	
				CN	1457343 A	19-11-2003
				WO	02062869 A	
 !!\$	2002128427	· A1	12-09-2002	DE	10045719 A	04-04-2002
UJ	2002120427	V.I	12 09 2002	CN	1344754 A	17-04-2002
				EP	1188783 A2	
				ES	2217068 T3	3 01-11-2004
US	2003139543	A1	24-07-2003	DE	10001477 A	
				ΑT	261769 T	15-04-2004
				ΑU	2373101 A	24-07-2001
				CN	1395505 A	05-02-2003
				WO	0151199 A	19-07-2001
			•	EP	1251957 AT	
				TW	548132 B	21-08-2003
 !!¢	2002032300	A1	14-03-2002	US	6258925 B1	10-07-2001
00	LUULUJLJUU	77.	14 00 5005	AU	1356402 A	02-01-2003
				BR	0200448 A	29-04-2003
				CA	2368798 A	
				CN	1393482 A	29-01-2003
				EG	23090 A	31-03-2004
				EP	1270641 A2	
				JP	2003026789 A	29-01-2003
				ΜX	PA02001767 A	23-01-2003
					PA02001767 A 574251 B	23-01-2003 01-02-2004
				MX TW		01-02-2004
				MX	574251 B	01-02-2004 07-07-2001

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation No
PCT/EP2005/002003

	Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	US 2002032300	A1		ID JP MX NO	28868 A 2001190963 A PA01000241 A 20010055 A	12-07-2001 17-07-2001 04-11-2002 09-07-2001
				NZ	509185 A	30-11-2001
1				PL	344958 A1	16-07-2001
				AU	771037 B2	11-03-2004
				AU BR	1002901 A 0100020 A	26-07-2001 28-08-2001
				ZA	200100131 A	09-07-2001
					Z00100131 A	09-07-2001
	EP 0939095	Α	01-09-1999	CN	1227853 A ,C	08-09-1999
	LI 0939093		01 05 1555	DE	69908209·D1	03-07-2003
1				DE	69908209 T2	25-03-2004
•				EP	0939095 A2	01-09-1999
İ	•			ES	2200468 T3	01-03-2004
				ID	23606 A	04-05-2000
1				JP	2000086748 A	28-03-2000
	•			TW	555779 B	01-10-2003
				US	6320014 B1	20-11-2001
Ì				US	2001017429 A1	30-08-2001
	US 5968429	Α	19-10-1999	AU	719114 B2	04-05-2000
	03 3900429	А	19-10-1999	AU	6764198 A	12-10-1998
				BR	9808276 A	16-05-2000
				CA	2284517 A1	24-09-1998
				CN	1250407 A ,C	
				EP	1009613 A1	21-06-2000
				JP	2001516297 T	25-09-2001
				WO	9841381 A1	24-09-1998
				AU	725646 B2	19-10-2000
				AU	6572398 A	12-10-1998
				AU	6763998 A	12-10-1998
4				AU	726051 B2	26-10-2000 12-10-1998
				AU Br	6764098 A 9808275 A	16-05-2000
]				BR	9808291 A	16-05-2000
1				CA	2283677 A1	24-09-1998
				CA	2285444 A1	24-09-1998
				CN	1107581 C	07-05-2003
				CN	1109705 C	28-05-2003
				DE	69806358 D1	08-08-2002
				DE	69806358 T2	13-03-2003
				DE	69808055 D1	24-10-2002
-				DE	69808055 T2	05-06-2003
İ				EP	0968243 A1	05-01-2000
	•			EP	0968076 A1	05-01-2000
1				ES	2175690 T3	16-11-2002 01-02-2003
				ES JP	2180157 T3 2001517164 T	01-02-2003 02-10-2001
				JP	3464489 B2	10-11-2003
				JP	2001516389 T	25-09-2001
				WO	9841559 A1	24-09-1998
				WO	9841375 A1	24-09-1998
1				WO	9841560 A1	24-09-1998
1				ÜS	5980797 A	09-11-1999
			•	US	5945460 A	31-08-1999

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C08G63/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK\ 7\ C08G$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C ALC WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Р,Х	WO 2004/055093 A (BUEHLER AG; CHR ANDREAS; CULBERT, BRENT, ALLAN) 1. Juli 2004 (2004-07-01) das ganze Dokument	ISTEL,	1-20
X	WO 03/085026 A (EUROTECNICA DEVEL LICENSING S.P.A; CODIGNOLA, FRANC 16. Oktober 2003 (2003-10-16) das ganze Dokument		1–20
X	WO 03/033581 A (TEIJIN LIMITED; N TAKUO; CHIKATSUNE, TETSUYA; NAKAS MINORU;) 24. April 2003 (2003-04- das ganze Dokument	HIMA,	1–20
X	US 2002/094402 A1 (JEN ZO-CHUN) 18. Juli 2002 (2002-07-18) das ganze Dokument	/	1-20
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	·
 Besonder "A" Veröffe aber n "E" ålteres Anmel "L" Veröffe schelr ander soll og ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe 	A Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Techrik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mi Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachman: "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	it worden ist und mit der ir zum Verständnis des der ir der der ihr zugrundellegenden ultung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und in ahellegend ist in Patentfamilie ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	echerchenberichts
	. Juni 2005		
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bedlensteter Glomm, B	



Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002003

		P2005/002003
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorieº	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 1 273 610 A (MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) 8. Januar 2003 (2003-01-08) das ganze Dokument	1-20
Х	US 2002/128427 A1 (SCHAAF ECKEHART ET AL) 12. September 2002 (2002-09-12) das ganze Dokument	1–20
X	US 2003/139543 A1 (WILHELM FRITZ ET AL) 24. Juli 2003 (2003-07-24) das ganze Dokument	1-20
X	US 2002/032300 A1 (DOWLING CONOR M ET AL) 14. März 2002 (2002–03–14) das ganze Dokument	1-20
X	EP 0 939.095 A (MITSUI CHEMICALS, INC) 1. September 1999 (1999-09-01) das ganze Dokument	1–20
X	US 5 968 429 A (TREECE ET AL) 19. Oktober 1999 (1999-10-19) das ganze Dokument 	1–20
		~.
		·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/002003

Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr. – weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich siehe BEIBLATT PCT/ISA/210
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenberlicht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld II.2

Ansprüche Nr.:

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 20 beziehen sich auf ein Verfahren, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich die Parameter entsprechend den letzten beiden Zeilen des vorliegenden Haptanspruchs 1 (" ... in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt ... "). Die Patentansprüche umfassen daher alle Verfahren, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen. wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Artikels 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Verfahren liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Masse, dass eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Artikels 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Verfahren über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, dass er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich die Teile betreffend die Verfahren, die in den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 der Beschreibung als bevorzugte Ausführungsformen der Anmeldung definiert sind.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit, der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentanprüche vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mängel behoben sein, die zu der Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)

Internativales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002003

March Recharcharchericht						2003/002003
MU 2003269668 A1 09-07-2004						
W0 03085026 A 16-10-2003 IT M120020734 A1 08-10-2003 AU 2003229628 A1 20-10-2003 AU 2003229628 A1 20-10-2003 EP 1492835 A1 05-01-2005 EP 1492835 A1 05-01-2005 EP 1492835 A1 05-01-2005 A1 A2-04-2003 JP 2003128623 A 08-05-2003 JP 2003128623 A 08-05-2003 JP 2003126061 A 03-06-2003 JP 2003160651 A 03-06-2003 JP 2003160653 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2004 A1 A1-06-2004 A1 A1-06-2004 A1 A1-06-2004 A1 A1-06-2004 A1 A1-06-2005 A1-06-2	WO 2004055093	A	01-07-2004			
AU 2003229628 A1 20-10-2003 16-10-2003 16-10-2005 1492835 A1 16-10-2005 1492835 A1 16-10-2005 1492835 A1 16-10-2005 1492835 A1 14-10-2003 15-10-2005 1492835 A1 14-10-2003 15-10-20						
W0 03085026 A1 16-10-2003 EP 1492835 A1 05-01-2005 W0 03033581 A 24-04-2003 JP 2003119316 A 23-04-2003 JP 2003126800 A 08-05-2003 JP 2003160651 A 03-06-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003360654 A 03-06-2003 JP 2003360654 A 03-06-2003 JP 2003360654 A 03-06-2003 JP 20033581 A1 24-04-2003 JP 20033581 A1 24-04-2003 JF 2005004390 A1 06-01-2005 JF 2005004390 A1 06-01-2003	WO. 03085026	A	16-10-2003			
FP						
W0 03033581 A 24-04-2003 JP 2003119316 A 23-04-2003 JP 2003128603 A 08-05-2003 JP 2003128600 A 08-05-2003 JP 2003160651 A 03-06-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 20033581 A1 24-04-2004 W0 03033581 A1 24-04-2003 WX PA04003380 A 21-06-2004 WS 2005004390 A1 106-01-2005 US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A1 08-01-2005 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2003019667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 W0 02062869 A1 15-08-2002 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2004 EP 1188783 A2 20-03-2004 EP 1188783 A2 20-03-2004 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2003023300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 574251 B 01-02-2004 TW 5742						
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 1004574 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 1004574 A1 16-08-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 US 200203334 A2 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 EP 1251957 A1 30-1						
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 108-01-2003 JP 2002226569 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226569 A 14-08-2002 EP 1273610 A 108-01-2003 JP 2002226569 A 19-01-2003 US 2002094402 A1 12-06-2003 JP 2002226569 A 11-06-2004 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 12-06-2003 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2002022300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 EP 1251957 A1 30-10-2002 EP 1251957 A1 30-10-2002 EP 1251957 A1 30-10-2002 EP 1251957 A1 30-10-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 EP 1270641 A2 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 EP 1270641 A2 02-01-2003 EP 1270641 A2 02-01-2003 EP 1270641 A2 02-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003	WO 03033581	Α	24-04-2003			
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2003100651 A 03-06-2003 JP 2003160652 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 JP 2003160654 A 03-06-2003 EP 1437377 A1 14-07-2004 W0 03033581 A1 24-04-2003 WX PA04003380 A 21-06-2004 WS 2005004390 A1 06-01-2005 WS 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 DE Q 2303026789 A 29-01-2003 DE Q 2302026781 A 29-01-2003 DE Q 2303026789 A 29-01-2003 DE Q 2302026789 A 29-01-2003 DE Q 2002026789 A 29-01-2003 DE Q 20020267						
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226569 A 10-08-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2001 AU 2373101 A 24-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1394382 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003						
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 12-09-2003 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-03-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-03-2002 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 1001477 A1 16-08-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 19-07-2001 CN 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393560 A 05-02-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-04-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AD 1393482 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 625893 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 625893 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258938 A1 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 625893 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 625893 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 625893 A 29-01-2003 US 2002032300 A1 14-03-2004 US 20020323300 A1 14-03-2004 US 20020323300 A1 14-03-2004 U						
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JS 2003109667 A1 12-06-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1551957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-01-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003						
CN						
FP						
W0						26-01-2005
MX						14-07-2004
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 CN 1344754 A 17-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 B 21-08-2003 TW 548132 TW 548132 TW 548132 TW 548132 TW 548132 TW						24-04-2003
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1250441 A2 29-01-2003 BR 0200448 A 29-01-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						21-06-2004
US 2002094402 A1 18-07-2002 JP 2002226568 A 14-08-2002 EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002						
EP 1273610 A 08-01-2003 JP 2002226563 A 14-08-2002 EP 1273610 A1 08-01-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN 1457343 A 19-11-2003 WO 02062869 A1 15-08-2002 US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 AT 261769 T 15-04-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 EP 1270641 A2 29-01-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 DE G 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DE G 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DE G 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DE D 2003026789 A 29-01-2003 DE CA 2330283 A1 07-07-2001 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001				US 	2005004390 A1	06-01-2005
EP 1273610 A1 08-01-2003 US 2003109667 A1 12-06-2003 US 2004044173 A1 04-03-2004 CN	US 2002094402	A1	18-07-2002	JP	2002226568 A	14-08-2002
EP	EP 1273610	Α	08-01-2003	JP	2002226563 A	14-08-2002
US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 1001477 A1 16-08-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 29-01-2003 CN 139482 A 29-01-2003 CN 139482 A 29-01-2003 CN 1393482 A 29-01-20						
US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 CN 1344754 A 17-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DF 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DF 1270641 A2 02-01-20						
US 2002128427 A1 12-09-2002 DE 10045719 A1 04-04-2002 CN 1344754 A 17-04-2002 EP 1188783 A2 20-03-2002 ES 2217068 T3 01-11-2004 US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 DP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001		•	•			
US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 DE 02002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 DE 02002032300 DE 0200202032300 DE 0200202032300 DE 0200202032300 DE 0200202032300 DE 02002032300 DE 02002020202020 DE 020020202020200 DE 020020202020200 DE 0200202020200 DE 0200202020202020200 DE 0200202020202020202000 DE 02002020202020202020202020202020202020	US 2002128427	A1	12-09-2002			
US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 WO 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
US 2003139543 A1 24-07-2003 DE 10001477 A1 16-08-2001 AT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
MT 261769 T 15-04-2004 AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001				ES	2217068 T3	01-11-2004
AU 2373101 A 24-07-2001 CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001	US 2003139543	A 1	24-07-2003			
CN 1395505 A 05-02-2003 W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
W0 0151199 A1 19-07-2001 EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
EP 1251957 A1 30-10-2002 TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
TW 548132 B 21-08-2003 US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
US 2002032300 A1 14-03-2002 US 6258925 B1 10-07-2001 AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
AU 1356402 A 02-01-2003 BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001					548132 B	21-08-2003
BR 0200448 A 29-04-2003 CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001	US 2002032300	A1	14-03-2002			
CA 2368798 A1 29-12-2002 CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
CN 1393482 A 29-01-2003 EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
EG 23090 A 31-03-2004 EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
EP 1270641 A2 02-01-2003 JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
JP 2003026789 A 29-01-2003 MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
MX PA02001767 A 23-01-2003 TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
TW 574251 B 01-02-2004 CA 2330283 A1 07-07-2001						
CA 2330283 A1 07-07-2001						
CN 1359963 A .C 24-07-2002						
EP 1114838 A1 11-07-2001				EP		11-07-2001

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002003

Im Recherchenberi geführtes Patentdok		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 20020323	00 A1		ID	28868 A	12-07-2001
03 20020323	no vi		JP	2001190963 A	17-07-2001
			MX	PA01000241 A	04-11-2002
			NO	20010055 A	09-07-2001
			NZ	509185 A	30-11-2001
•			PL	344958 A1	
			AU	771037 B2	
			AU	1002901 A	26-07-2001
			BR	0100020 A	28-08-2001
			ZA	200100131 A	09-07-2001
EP 0939095	 А	01-09-1999	CN	1227853 A	.C 08-09-1999
			DE	69908209 D1	
			DĒ	69908209 T2	
			ĒΡ	0939095 A2	
			ES	2200468 T3	
			ID	23606 A	04-05-2004
			JP	2000086748 A	28-03-2000
•			TW	555779 B	01-10-2003
			US	6320014 BI	
			US	2001017429 A	30-08-2001
US 5968429	Α	19-10-1999	AU	719114 B2	
			AU	6764198 A	12-10-1998
			BR	9808276 A	16-05-2000
			CA	2284517 A1	l 24-09-1998
	•		CN	1250407 A	,C 12-04-2000
			EP	1009613 A1	
	•		JР	2001516297 T	25-09-2001
			WO	9841381 A1	
			AU	725646 B2	
•			AU	6572398 A	12-10-1998
					12-10-1998
			AU	6763998 A	
		•	AU	726051 B2	
			AU	6764098 A	12-10-1998
			BR	9808275 A	16-05-2000
			BR	9808291 A	16-05-2000
			CA	2283677 A	
			CA	2285444 AI	
			CN	1107581 C	07-05-2003
		•	CN	1109705 C	28-05-2003
			DE	69806358 D1	
			DE	69806358 T2	
			DE	69808055 D1	
			DE	69808055 T2	
			EP	0968243 A1	
			EP	0968076 AI	
•			ES	2175690 T3	
			ES	2180157 T3	
			JP	2001517164 T	02-10-2001
			JP	3464489 B2	
			JP	2001516389 T	25-09-2001
			WO	9841559 A1	
			WO	9841375 A	
			WO	9841560 A	
			wat /	JUTIJUU MI	LT UJ XJJU
				5020707 A	
			US US	5980797 A 5945460 A	09-11-1999 31-08-1999